

正电子湮没谱学技术及应用

主讲人：杜海燕 博士

主讲人自2023至今，在CSNS加速器束扩组工作

正电子湮没谱学技术（PAT）是一种基于正电子与物质中电子湮没现象的先进探测技术，能够提供物质内部微观结构、缺陷状态和电子动量分布等信息，广泛应用于半导体、金属、化学、核材料、多孔材料、聚合物等研究中。本报告将介绍正电子湮没谱学技术，包括正电子寿命谱学、多普勒谱学和角关联技术，以及正电子源和正电子的其他应用。

2025/08/15 周五

14:30 — 16:30

报告地点：A1-2楼学术活动室
腾讯会议：933-4994-4002



Contact: yubao@ihep.ac.cn

yih@ihep.ac.cn guoyh@ihep.ac.cn

Made by Qiuyue Luo



中国散裂中子源
China Spallation Neutron Source

